



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΤΡΑ
SPM SCANNING PROBE MICROSCOPY & AFM ATOMIC FORCE MICROSCOPE
VEECO
Τετάρτη 2 Απριλίου 2008

Η Εταιρεία VEECO – πρωτοπόρος στη Μετρολογία – συνεχίζει να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών και νέων εφαρμογών. Στα πλαίσια αυτά η Εταιρεία μας, σε συνεργασία με τον οίκο Veeco, έχει την τιμή να σας προσκαλέσει την Τετάρτη 2 Απριλίου 2008 και ώρα 08:30 στην αίθουσα Σεμιναρίων του ΕΙΧΗΜΥΘ στην Πάτρα, για τις νεώτερες εξελίξεις στον τομέα της **Μικροσκοπίας Σάρωσης Ακίδας (SPM) & Μικροσκοπίας Ατομικής Δύναμης (AFM).**

Οι ομιλίες θα δοθούν από τον ειδικό επιστήμονα Dr. Hartmut Stadler.

09.00-09:30 *Προσέλευση – Καφές- Αναψυκτικά*

09:30-09:35 Welcome to the Seminar

Δ. Σταμέλος

09:35-09:45 Veeco Introduction

Dr. H. Stadler

09:45-10:45 Scanning Probe Microscopy
New Trends & Developments

Dr. H. Stadler

10:45-11.00 *Διάλειμμα - Καφές - Αναψυκτικά*

11:00-12:00 SPM/AFM Applications Materials, Polymers and
Biological samples

Dr. H. Stadler

12:00-12:30 *Ελαφρύ γεύμα*

12:30-13:00 Innova – Versatile SPM System for research

Dr. H. Stadler

13:00:16:00 Ερωτήσεις

Θα δοθεί *Βεβαίωση Συμμετοχής* σε όσους παρακολουθήσουν το Σεμινάριο Μετρολογίας VEECO.

Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι το αργότερο Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008, στην κα Ράνια Γεωργίου, τηλ. 210-6748973 (εσωτ. 810) ή fax 210-6748978, ή e-mail rgeorgiou@analytical.gr

Με εκτίμηση,
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

Δ. Σταμέλος
Χημικός
Δ/ντής Πωλήσεων Veeco